《解説》

ゼオライトに担持した金属クラスターの

XAFSによる状態解析

奥村 和

鳥取大学工学部物質工学科

XAFS はゼオライトを担持した金属の構造や電子状態を調べるための強力な手段である。たと えばXAFS によってゼオライトに担持した金属の粒子径や形状に関する情報,またゼオライト 細孔内での金属クラスターの生成過程や存在箇所を調べることができる。また筆者らはこの XAFS の手法を様々なゼオライトを担体としたパラジウム触媒に適用し,ゼオライトの酸性質が Pdの構造や触媒作用に及ぼす影響を検討してきた。その結果,ゼオライトの酸点により高分散 された酸化パラジウムが保たれていること,Pd金属の生成,メタン燃焼反応や選択的NO還元 反応にゼオライトの酸点が強く関与していることを見出した。

1. はじめに

XAFS は周期表の大部分の元素に対して高感度な 分析が可能である。特に触媒・非晶質・生体試料・ 溶液といった様々な固相や液相の試料において、そ の局所構造や電子状態を調べるには非常に有用な手 法である。またXAFSの測定には実験室系に加え、 近年建設が進んだシンクロトロン放射光を使った測 定が開発されており,様々な試料に対して強力な手 段として近年不可欠な手法になりつつある。わが国 では従来の高エネルギー加速器研究機構のフォト ン・ファクトリー (PF) に加え、1997年から高輝 度科学研究センター(SPring-8)において放射光を 使った実験が行われており、ますます XAFS を測定 する機会が増えてきている。このXAFS によってゼ オライトを担体とした金属触媒を分析した例は数多 くある。例えば金属粒子の粒子径、構造や電子状態 などの観察や、触媒の調製過程や吸着ガスの影響、 さらに触媒作用の解明を目的としてXAFS は用いら れている。筆者らはこのXAFSの手法を生かし、ゼ オライトに担持したパラジウム触媒について、ゼオ

〒680-8552 鳥取市湖山町南4-101 鳥取大学工学部物質工学科 e-mail: okmr@chem.tottori-u.ac.jp ライトの構造や酸性質がそこに担持したパラジウム の構造に及ぼす影響を検討し、パラジウムの触媒作 用と関連づけてきた。このPd/ゼオライト触媒は低 担持量のPdが、PdのK吸収端(24.3 keV)におい てほぼ透明であるゼオライトに分散させた状態で存 在している。よって、活性点であるPdの構造を容易 に調べることが出来る。そこで本稿ではまずXAFS の金属/ゼオライト系の試料への応用例と最近の展 開、さらに筆者らのXAFSを使ったパラジウム触媒 に関するこれまでの研究について報告したい。

2. ゼオライトに担持した金属クラスターについて XAFS から得られる情報

担体上に分散している金属粒子の粒子径を求める には透過型電子顕微鏡が使われることが多いが,ゼ オライト細孔内で金属が高分散している場合にはゼ オライトと金属のコントラストの差が明確ではなく なるため,電子顕微鏡による観察は困難である。こ のような試料に対してもEXAFSによって測定した 金属原子間の配位数から平均の粒子径を見積もるこ とが可能である。(ただしXAFSによる解析が意味 をもつのは粒子径がシャープで,均一に分布してい る場合に限られる。また粒子径の分布がブロードで あったり,2種類に分かれていた場合には,サイズ の大きな粒子による寄与が大きくなるという難点が あるので注意を払う必要がある¹⁾。)またEXAFSで 第一~第三配位圏に現れる金属の配位数を比較する ことによって,球形,半球形,シリンダー状といっ た粒子の形状の推定することもできる。その事例と して,HallerらのL型ゼオライトに担持したPd粒子 の形状についての報告がある。2 wt%のPdを担持し たKL-ゼオライトのEXAFSでは第二配位圏に現れ るPd-Pdの強度が小さいことから,平板状の金属Pd 粒子が細孔内で生成していることが分かっている²⁾。

またXAFS によってゼオライト細孔内での金属ク ラスターの生成過程、ゼオライト内でクラスターの 存在している場所などを明確にすることができる。 例えばLercher らはゼオライト細孔内でさまざまな 方法によって調製したPt クラスターの粒子径を EXAFS によって調べ、イオン交換法によって調製 したPt クラスターが含浸法や気相吸着法によるもの よりも小さなサイズであること、塩基性をもつゼオ ライト上でPtの微粒子が出来やすいことを報告して いる。ゼオライト細孔内で骨格と接している金属ク ラスターのデバイーワラー因子が大きくなるという 傾向があるため、一定の条件下では細孔の中にある Pt クラスターを外にあるものと区別することが可能 であることも報告されている³⁾。さらにXANES領 域のデータをEXAFSと相補的に使って、ゼオライ ト細孔内のPt,クラスターのサイズや形状も予測さ れている4)。

Koningsbergerらは従来無視されてきたフーリエ 変換スペクトルに現れる1 A以下のピークが金属ク ラスターの原子間のポテンシャルを反映しており, そこには有用な情報が含まれていることを示してい る。これらはAtomic XAFS (AXAFS) と称されて いる⁵, Atomic XAFS によって, Pt触媒でのネオペ ンタンの異性化や水素化活性に対する担体効果が説 明されている。この担持Pt触媒では担体が電子不足 状態になるほどPt L₃ edgeでの1 A以下に現れるピ ークの強度が増大する様子が観察されており, 担体 の酸性質がPtの電子状態に影響し, 電荷の再配分が 起っていることが報告されている^{6,7}。

3. ゼオライトの酸性質による Pd への担体効果8)

担持Pd触媒において、担体の酸性質がPdの触媒 活性に強い影響を及ぼすことがある。例えばメタン を用いた酸素下での選択的NO還元反応において、

担体の酸性質の存在が不可欠である。一方、メタン の燃焼反応では酸量によってその挙動が異なる。し たがって、ゼオライトの酸点と密接に関わることに より起こったパラジウムの構造や電子状態の変化が、 その触媒作用の変化を引き起こしたと推測される。 担体として使用しているゼオライトは、含有するAl の濃度を調節することでその酸量を制御することが 容易に出来るため、このようなPdに対する酸点の影 響を調べるには適しているといえよう。これらの試 料では1 wt%以下の低濃度のPdがゼオライト細孔内 で分散した状態で存在していることが多いが、Pdの 構造や電子状態は高輝度の放射光を使用したXAFS 測定により容易に捉えることができる。本研究では 主として0.2 wt%のPdをゼオライトに担持した試料 についてPd K-edge XAFS によってPd の局所構造を 調べ、ゼオライトの酸点によるPdへの担体効果につ いて検討した。測定したデータはすべてSPring-8 BL01B1において、通常の透過法により室温で測定 したものである。試料はさまざまな処理ののち、30 mmの光路をもつセルに封入し、わずかに減圧にし たのち封じ切っている。一時間程度の測定時間で, 約k = 16 Å⁻¹まで十分に解析が可能な、質の高いス ペクトルを得ることが出来る。

3.1 酸化パラジウムのゼオライトの酸点上への分散⁹⁾ ゼオライトの酸点がパラジウムの構造に及ぼす影

響を調べるために,次のような処理を行った。様々 なAl濃度(酸量)を有する酸型,およびNa型の ZSM-5にPd(NH3)4Cl2をイオン交換法によって導入 し (Pd, 0.2 wt%), 各試料についてN2下での焼成, およびO2酸化後にPd K-edge XAFSを測定し,各 処理に伴うPdの局所構造変化を調べた(図1)。そ の結果, N₂流通下773 K で前処理を行ったところ, Pd 箔の標準試料と比較しても分かるように、全ての 試料で金属Pdが観測された(図1(a))。最近接のPd-Pd 配位数から、この金属Pdの粒径は1.5 nm以上で あると推定される。そのサイズはZSM-5の細孔径を 越えており、PdはZSM-5の外表面に存在している と考えられる。こうしたことからイオン交換された アンミン錯体がN2下で熱分解し、ZSM-5の外表面 上でPdが凝集したと推測される。さらにO2下, 773 Kで4h酸化処理後にEXAFSスペクトルを測定した (図1(b))。比較のために示した標準試料であるPdO



図1 (a) N₂下,および (b) O₂流通下,773 K で焼成後に測定したPd/Na-および,H-ZSM-5のPd K-edge EXAFS フーリエ変 換スペクトル;Pd, 0.2 wt%



 図2 773 Kでの酸化・還元による酸点上に高分散したPdOとPd金属の可逆的生成;Pd/HZSM-5 (Si/Al₂=55), Pd 0.2 wt%

にはPd-O (2.02 Å) と2種のPd (3.04, 3.42 Å) が現 れている。このPd-Pd によるピークはAl 濃度の低い HZSM-5上でも観測されるが、Al 濃度の増加に伴っ てその減少し、最も酸量の多いSi/Al₂=24では消失 していることがわかる。Pd-Pd の配位数はPdO のサ イズを反映していると考えられるので、この現象は ZSM-5上の酸濃度の増加に伴いPdO が高分散化され ていることを示している。つまりN₂下での焼成後に 一旦ゼオライトの外表面に出た金属Pd が、酸化処理 によりゼオライト細孔内に戻り酸点上に再分散した ため、ゼオライトの酸量が多いほど高分散化した PdO が生成されているといえる。



図3 酸素雰囲気下での焼成によるゼオライトの酸点上にお けるパラジウムの可逆的な高分散過程

さらに様々なAl 濃度をもつPd/HZSM-5の各試料 について773 KでのH₂による還元とO₂下での酸化 を繰り返し,酸化・還元処理に伴うPdの構造変化を 追った。一例としてPd/ZSM-5 (Si/Al₂=55)で測定 したスペクトルを図2に示している。酸化処理を行 った試料をH₂により還元したところ,ZSM-5の細 孔径を超える3 nm以上の金属Pd粒子が見られた。 さらに引き続き再酸化を行ったところ,最初の酸化 後と同一のスペクトルが得られ,ゼオライト細孔内 でサイズの異なるPdOクラスターが酸化・還元処理 により可逆的に生成する様子が観察された。この結 果は図3に示すように酸化と還元を繰り返すことで, ゼオライトの酸点とPdOが強く相互作用によりPd

101



図4 H₂による還元後,O₂流通下さまざまな温度で焼成したPd/HZSM-5 (Si/Al₂=23.8)のEXAFSフーリエ変換スペクトル

がZSM-5の細孔の内外を可逆的に行き来しており、 Pdが動きやすい性質を持っていることを明確に示し ている。このような酸型のZSM-5上で観察された酸 点によるPdの高分散化と動的挙動の要因はPdOの 塩基性にあると考えられる。いいかえればゼオライ トの酸点と塩基性を有するPdOの間での酸塩基相互 作用が、可逆的な反応を引き起こしたと推測される。

3.2 PdOのゼオライトの酸点上への高分散化過程10) 3.1で観察されたPdOのゼオライトの酸点上への 高分散化過程を明らかにするために、もっともPdO が高分散していたZSM-5(Si/Al2=23.8)上で、さ まざまな温度で酸素下において焼成を行い, Pdの構 造をEXAFSによって明らかにした。まず試料を水 素下773 Kで還元し、凝集した金属Pdを生成させ た。次に1%酸素を流通させ、573 Kから773 Kま での酸化に伴う構造の変化を調べた(図4)。573 K で酸化したところ、Pd は部分的に酸化され、酸化物 と金属が混在した状態にあることがわかる。さらに 酸化処理温度を上げると、金属Pdによる0.25 nmの ピークが消失し、PdOに特徴的な2本のPd-Pdピー クが新たに現れた(配位数はそれぞれ3.1,4.6であ った)。酸素雰囲気下で焼成温度を上げると、この PdOによるPd-Pd 結合が減少し(723 K), 完全に消 失している(773 K)。以上の結果は、高分散化が2 段階にわたって起こることを示している。つまり, まずゼオライトの外表面に存在している金属Pdが単 に酸化され凝集したPdOが生成し、さらに673 K以



図5 773 Kでの酸化処理の後,423 Kで水素により還元し たPd/HZSM-5のEXAFS フーリエ変換スペクトル

上に昇温すると、ゼオライトの酸点上にこのPdOが 高分散しているといえる。

3.3 金属 Pd 微粒子の生成¹¹⁾

上記のような酸点との相互作用によりゼオライト の酸点上に高分散されたPdO を低温で還元すること で、もとの分散状態を保ったまま金属Pdへの転換が 可能であると予測されるであろう。この考えに基づ き773 K での酸化後. 423 K で水素による還元をお こないEXAFS スペクトルを測定した(図5)。この 図によれば、金属パラジウムに特徴的なPd-Pdピー クは2.5 Aに現れているが、ZSM-5のAI濃度が高い ほど、このPd-Pd 強度は低下している。これは担体 の酸量が多いほど、生成した金属Pdの分散度が増大 していることを示しており,酸化後に生成したPdO の分散状態の序列と一致していた。したがって423 Kという低温で還元することによって、PdOの分散 状態を保ったまま金属Pdが得られることが分かる。 さらに、このなかで最もAl濃度の高いZSM-5 (Si/Al₂=24) 上では最近接のPd-Pd 結合の配位数が 3であったことから、4核程度の金属Pdクラスター が生成しているものと考えられる。そこでこれらの 還元後の試料においてベンゼンの水素化反応をおこ なったところ、EXAFS の結果に対応して酸量の増 加に従って活性が増大し、最も高分散状態が得られ たPd/ZSM-5 (Si/Al2=24) が最大活性を示しており, EXAFS で観測された分散度の傾向とよく一致して いた。

(18)

(b) Pd-Pd(PdO) Pd-Pd(PdO) (a) 50-Pd-O 40-Si/Al₂=90 Pd⁰ Si/Al₂=30 Pd-O 40 after after 30 F(r) <u>E</u> 30 before before 20 20-Si/Al₂=15 Si/Al₂=24 after after 10 10 before before Ś 5 Ż Ò Ż à Distance/0.1 nm Distance/0.1 nm

図6 酸素下での前処理後、およびメタン燃焼反応後に測定した (a) Pd/H-ZSM-5, (b) Pd/H-モルデナイトのEXAFS フーリエ 変換スペクトル

ZSM-5のAI 濃度がPdのメタン燃焼活性と局所 構造に及ぼす影響¹²⁾

ゼオライトを担体としたPd 触媒はメタンの完全 燃焼反応に高い活性を示すことが知られている。し かし、その触媒作用はゼオライトの酸性質や構造の 影響を強く受ける。例えばメタン:酸素:窒素= 1:2:7 の条件下において酸型のZSM-5とモルデナ イトを担体として反応を行ったところ、それぞれ Si/Al₂=200と30の場合にPdは最大活性を示し、ま た組成によらずZSM-5よりもモルデナイトを担体と した場合ににPdは高い活性を示した12)。この理由 を探るためにメタン燃焼反応前後におけるEXAFS スペクトルを測定した(図6)。まず,773 K におい て酸素下で前処理をおこなったところ、すべての試 料で分散状態は異なるものの酸化パラジウムが生成 していた。しかしメタン燃焼反応後ではZSM-5上に おいてPd は酸化状態を保っていたのに対し(図 6(a)), モルデナイトを担体とした場合には金属Pd と凝集したPdO が混在した状態にあることが分かる (図6(b))。次に酸素に対する反応次数を測定したと ころ、Pd/ZSM-5では0次であったのに対し、Pd/モ ルデナイトでは1次であった。また活性化エネルギ ーを測定したところ, Pd/ZSM-5では59~63 kJ mol-1でありPdOで観測される値と一致したのに対 し、Pd/モルデナイトでは131~169 kJ mol-1であ り、金属Pdで報告されている結果に対応している。 したがって、メタン燃焼反応下においてはPd/モル

デナイトでは金属Pdが安定に存在していることが強 く示唆される。したがって、これらの結果はメタン 燃焼反応中に生じる金属Pdが、Pd/モルデナイトの 高活性の原因となることを示しているものと推察さ れる。実際にPdOからPdへ相転移する際、あるい はメタンをPdOにパルスすることでわずかな金属Pd が生じた時にメタン燃焼活性が急激に高まることが 報告されている。Pdの金属と酸化物が反応中では混 在したことがモルデナイト上でPdが高い燃焼活性を 示したものと考えられる。またこの結果はPd/ZrO₂ がトルエン燃焼活性において高い活性を示す原因と 類似している。

Bel に対するゼオライトの酸点の役割とNOの吸着・脱離に伴うPdの局所構造変化¹³⁾

パラジウムはNOを還元剤とした酸素雰囲気下で のメタンによる選択的還元(SCR)反応に高い活性 を示す。この反応にPdが高い活性を示すためには, 既に述べたように酸性質を持った担体を使用するこ とが必須である¹⁴⁾。そこでXAFSによってパラジウ ムに対する酸点の役割を検討し,さらにNOや反応 ガス雰囲気下におけるZSM-5の酸点上でのパラジウ ムの構造変化を調べた。まず酸型,および酸点のな いNa型ZSM-5(Si/Al₂=23.8)に0.2 wt%のパラジ ウムを担持し,酸化処理を773 Kで行ったのちに XAFSを測定すると,既に図1(b)に示したように両 者で全く異なった結果が得られた。すなわち Pd/HZSM-5ではPd-O結合は見られるものの,Pd-Pd結合が現れておらず高分散したPdOが生成してい た。それに対し,酸点をもたないNa型のZSM-5を 担体とした場合にはバルクPdOと同程度の強度で Pd-Pd結合が観測されており,凝集したPdOが生成 していることが分かる。したがって,酸点はPdOを 高分散させる働きがあることがわかる。

さらにZSM-5の酸点上に高分散したPdOへのNO の吸着・脱離,および反応ガス雰囲気下でのパラジ ウムの構造変化を調べ,Na型と酸型ZSM-5を比較 した。図7に酸素処理後のPd/HZSM-5にNO(1000 ppm)を室温で吸着させ,さらに昇温した後に測定



図7 NOを吸着・昇温して測定したPd/HZSM-5 (Si/Al₂ = 23.8)のEXAFS フーリエ変換スペクトル; (a) 酸化前処理後, (b)-(d) NO吸着・昇温後

したEXAFS スペクトルを示した。酸化処理後(図 7(a))とNO吸着後(図7(b))のスペクトルを比較 すると,NO吸着に伴い第一配位圈(Pd-O結合)の 強度が約1/4に低下していることがわかる。NO吸着 前後での吸収端近傍(XANES)領域を比較すると, NO吸着後では吸収端が約1 eV低エネルギー側にシ フトしており,パラジウムが酸化後の2価からNO の吸着により1価に還元されていることが示唆され る。さらにNOを吸着後,673 Kまで昇温したとこ ろ,再び前処理後に近いスペクトルが回復している 様子が見られる。同時にTPDスペクトルを測定した ところ,480~680 K にかけてNOの脱離が観測され た。したがってEXAFSで観測された変化はPd上に おけるNOの吸着・脱離によって引き起こされたも のであることがわかる。

ゼオライト上に担持したパラジウム触媒ではNO-CH₄-O₂反応中に空気中に存在する水蒸気によって 劣化するという問題点がある。水蒸気がPdに及ぼす 影響を調べるために,10%水蒸気存在下でNO-CH₄-O₂反応をおこない,反応後にEXAFSスペクトルを 測定したところ,Pd/HZSM-5では酸化パラジウム によるPd-Pdピークが成長していた(図8(c))。した がって水蒸気による劣化の要因の一つはパラジウム のシンタリングによることが確認される。

一方, Pd/NaZSM-5 では酸型のZSM-5 において 見られたようなNO吸着に伴うPd 周囲の構造や価数 の変化はXAFS では観測されず,凝集したPdOが生 成していた。Pd/NaZSM-5上ではメタン燃焼反応が



図8 Pd 担持Na-およびHZSM-5 (Si/Al₂=23.8 でのNOの吸着・脱離に伴うPd 周囲の構造変化; (a) 酸化後, (b) NO-CH₄-O₂ 反応後, (c) 10 % 水蒸気下でのNO-CH₄-O₂反応後;反応時間,4時間

選択的に起こり、NOのN₂への選択性は4%以下と低い。この結果は酸量の減少に伴ってHZSM-5上でのPdOの粒子成長とメタン燃焼活性の増大の傾向と一致する。このようにPdの分散状態は担体の酸量に強く依存し、高分散したHZSM-5上のPdOにNOを吸着させることで、Pdの局所構造や電子状態が著しく変化している様子がXAFSによって明確に捉えられている。

4. おわりに

本稿で述べた以外にも、XAFS はさまざまな試 料・目的に使われているが、多くの研究ではXAFS と同時に他の分析法と組み合わせることにより、よ り明確なキャラクタリゼーションがなされている。 また最近では従来の静的条件下での測定に加え、insitu 下での測定やDXAFS といった新しい手法で測 定が行われてきており、よりXAFSの可能性が広が りつつある。SPring-8 に関して述べると、筆者らも BL38 において市販の石英製IR セルを使った測定を 開始しており、現在のところ常圧下であれば簡便な 測定が可能である。また2002年7月からBL28B2に おいて時間分解XAFS 実験を開始しており、金属元 素をゼオライトに担持した試料についても、従来に はない動的な観察が可能になるものと期待している。

文 献

- D. E. Ramaker, J. De Graaf, J. A. F. van Veen, and D. C. Koningsberger, J. Catal., 203, 7 (2001).
- 2) P. V. Menacherry, M. Fernandez-Garcia, and G. L. Haller, J. Catal., 166, 75 (1997).
- A. Jentys, L. Simon, and J. A. Lercher, J. Phys. Chem. B, 104, 9411 (2000).
- A. L. Ankudinov, J. J. Rehr, J. J. Low, and S. R. Bare, J. Chem. Phys., 116, 1911 (2002).
- 5) M. Jacoby, Chem. Eng. News, 80, 37 (2002).
- D. E. Ramaker, J. de Graaf, J. A. R. van Veen, and D. C. Koningsberger, J. Catal., 203, 7 (2001).
- D. E. Ramaker, G. E. van Dorssen, B. L. Mojet, and D. C. Koningsberger, *Top. Catal.*, 10, 157 (2000).
- K. Okumura and M. Niwa, *Catal. Surv. Japan*, 5, 121-126 (2002).
- 9) K. Okumura, J. Amano, and M. Niwa, *Chem. Lett.*, 997 (1999).
- K. Okumura and M. Niwa, J. Phys. Chem. B, 104, 9670-9675 (2000).
- 11) K. Okumura and M. Niwa, *Topics in Catalysis*, 18, 85-89 (2002).
- 12) K. Okumura, S. Matsumoto, N. Nishiaki, and M. Niwa, *Appl. Catal. B* in press.
- K. Okumura, J. Amano, N. Yasunobu, and M. Niwa, J. Phys. Chem. B, 104, 1050-1057 (2000).
- 14) K. Okumura, T. Kusakabe, N. Yasunobu, and M. Niwa, *Chem. Lett.*, 1018 (2001).

XAFS Analysis of the Metal Cluster Supported on Zeolites

Kazu Okumura

Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Tottori University

XAFS has been used as a powerful tool for the characterization of structure and electronic properties of metals supported on zeolites. Valuable information such as diameter, shape of metals, genesis of metal particles in zeolite pore could be obtained from the XAFS measurement. The author has applied XAFS technique for the palladium catalyst supported on zeolite in order to reveal the influence of acidity of zeolites on the catalysis and structure of Pd. These studies revealed that the acid sites of zeolites affected profoundly on the generation of dispersed PdO, Pd metal and active species in the methane combustion and selective reduction of NO.

Keywords: XAFS, palladium, zeolite, catalysis